# C在不同位置掺杂(n, n)型BN纳米管的 密度泛函研究<sup>\*</sup>

王艳丽 苏克和 颜红侠 王欣

(西北工业大学理学院应用化学系,空间应用物理与化学教育部重点实验室,西安 710072)

(2013年9月8日收到; 2013年11月1日收到修改稿)

用密度泛函 B3LYP/3-21G(d) 方法,并利用周期边界条件,研究了C原子在不同位置掺杂的 (n,n)型 BN 纳米管的结构与性质.揭示了几何结构特征、能量、稳定性和能带结构的变化规律.研究了C 原子在B 位或 N 位置分别掺杂的 BN 纳米管的模型 (掺杂浓度 x = 1/(4n), n = 3—9),部分 B 位掺杂管发生了变形,而所有 N 位掺杂管则几乎不变形,而且 N 位比 B 位的掺杂能更低 (管更稳定), B 位掺杂管的能隙为 1.054—2.411 eV, N 掺杂管的能隙为 0.252—1.207 eV,所有掺杂管都是半导体,所有掺杂管都具有直接带隙.

关键词:掺杂,碳纳米管,周期边界条件,能带结构 PACS: 61.46.Np, 81.07.De

#### **DOI:** 10.7498/aps.63.046101

## 1引言

硼碳氮 (B-C-N)<sup>[1]</sup> 层状材料可认为是石墨和BN的混杂物.与石墨相仿,B-C-N层状材料也可生成纳米管,这类纳米管也可认为是碳纳米管 (CNT)与BN纳米管 (BN-NT)的混杂物.事实上,实验已经证实了B-C-N纳米管的存在<sup>[2]</sup>.理论和实验已证实BC<sub>2</sub>N纳米管具有半导体性质<sup>[3]</sup>,能隙为2 eV,BC<sub>2</sub>N纳米管还可成为有效的蓝光和紫外光发射器<sup>[4,5]</sup>.文献[6,7]研究了BC<sub>2</sub>N体系倾向于分裂为纯的C和BN区域的B-C-N体系.

Azevedo<sup>[8]</sup>研究了C在不同的位置掺杂的BN-NT,表明掺杂管的电子结构与形变结构无关,而与C原子的掺杂方式有关. 文献[9]研究C原子掺杂的(10,0)型BN纳米管得出,体系中若没有C—C键,就会产生自旋极化,掺杂体系可能会有微弱的磁性. C掺杂的(9,0) BN纳米管,发现H原子更易于吸附在C位上,而在纯的BN纳

米管上, H更易吸附在B 原子上<sup>[10]</sup>. Mirzaei<sup>[11]</sup> 计算所得的C在不同位置掺杂所得(4, 4)BN 纳 米管的N位掺杂的核磁共振(NMR)特征变化较 大, 而B 位掺杂几乎没什么变化. 文献[12]利 用C原子簇模型研究了C分别在B 位和N位掺 杂的BN纳米管, 得出C 在B 位掺杂的模型为宽 带隙半导体, 而在N位掺杂的模型为窄带隙半 导体.

本小组研究的(n, n)型CNT, BN-NT以及一 些B-C-N纳米管表明<sup>[13–15]</sup>,纳米管的导电性随 着n呈现出一定规律,并发现在B-C-N纳米管最 稳定结构的特征是碳纳米管中掺杂了平行于管 轴的-B-N-B-N-直链,这种管具有典型的半导体特 征<sup>[15]</sup>.而在BN纳米管中,C原子于-B-N-B-N-直 链上分别在B位或N位上取代的模型,其结构和性 能还是未知的,尤其是随管径的变化规律未见报 道.本文研究C原子在B或N位掺杂(n, n) BN纳 米管 (n = 3—9)模型的几何结构、掺杂能量和能带 结构特征.

\* 国家自然科学基金 (批准号: 50572089) 和西北工业大学基础基金 (批准号: JC201269) 资助的课题.

© 2014 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: wangyanli@nwpu.edu.cn

# 2 计算方法与模型

本文用密度泛函B3LYP方法和3-21G\*基组, 并利用周期边界条件(PBC)模拟两端开口的纳 米管超长结构<sup>[16]</sup>,研究了C原子分别在不同的 位置(即在B位或N位)替换掺杂(*n*, *n*)BN 纳米管 (*n* = 3—9)的结构.研究中选取一个原胞中的1个 原子被取代的模型;为保持重复单元的电中性,选取2个原胞为模型的最小重复单元.

3 结果与讨论

#### 3.1 结构变形与参数

C原子在B或N位掺杂(*n*, *n*) BN纳米管(*n* = 3—9), 掺杂浓度为一个原胞中掺杂一个C原子, 即



图 1 C 原子在 B 位掺杂扶手椅型 (*n*, *n*) BN 纳米管的管状和横截面结构 (a) (3, 3) 管; (b) (4, 4) 管; (c) (5, 5) 管; (d) (6, 6) 管; (e) (8, 8) 管; 实心原子表示一个原胞中的原子

掺杂比例为x = 1/(4n); 采用两个原胞作为一个模型的重复单元. C原子在B原子位置替换掺杂(n, n) BN 纳米管的结构如图1所示, 结构参数如表1 所列.

表1数据表明, 平键键长 $L_1$  (*X*—C) (*X* 代表 B或N原子, 下标1表示键与轴垂直) 总是比斜键 键长 $L_2$  (*X*—C)(下标2表示键和轴不垂直, 与轴倾 斜) 要长. 有些模型中的两个原胞中, 掺杂C 原子 的平键键长 $L_1(X$ —C) 或斜键键长 $L_2(X$ —C) 并不 相等, 故分别表示为 $L_1$  (*X*—C<sub>1</sub>) 和 $L_1(X$ —C<sub>2</sub>) 或  $L_2$  (X—C<sub>1</sub>) 和  $L_2$ (X—C<sub>2</sub>); 因此这些模型中, 掺 杂 C 原子的两管的管径也不同, 以  $D_1$  和  $D_2$  分别 代表掺杂 C 原子较大和较小的管径. 当n = 3,5,6时, 因两原胞中的 N—C 键的两个  $L_1$  键长不相等, 两个  $L_2$  键长也不相等,则 B 位掺杂 ( $C_B$ -doped) 的 BN 纳米管的  $D_1/D_2$  为 1.118, 1.077 和 1.067; 而 当n = 4 时和n = 7—9 时,  $C_B$ -doped 纳米管的  $D_1/D_2 = 1$ , 两管径并无差别. 而所有 N 位掺杂 C<sub>N</sub>-doped) 的 BN 纳米管, 两个原胞中的同类 B—C 键键长几乎没差别, 两管径也相等, 即  $D_1/D_2 = 1$ .

表 1 用 PBC-B3LYP/3-21G(d) 方法优化的 (n, n) 型 C 在 B 位和 N 位掺杂的 BN 纳米管的结构参数 (X = B, N, 参数下标的 数字表示原子的序号, 对应于图 1 上的原子标号)

| 掺杂位置 | n | $D(X - C_1)$ | $D(X - C_2)$ | $D_1/D_2$ | $L_1(X - C_1)$ | $L_1(X - C_2)$ | $L_2(X - C_1)$ | $L_2(X - C_2)$ | $\bar{a}$ | Mülliken | Mülliken |
|------|---|--------------|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|
|      |   | /nm          | /nm          |           | /nm            | /nm            | /nm            | /nm            | /nm       | $(C_1)$  | $(C_2)$  |
| В    | 3 | 0.4842       | 0.4330       | 1.118     | 0.1402         | 0.1587         | 0.1390         | 0.1638         | 0.5052    | 0.698    | 0.272    |
| В    | 4 | 0.6030       | 0.6031       | 1.000     | 0.1473         | 0.1473         | 0.1438         | 0.1473         | 0.5039    | 0.553    | 0.553    |
| В    | 5 | 0.7188       | 0.7747       | 1.077     | 0.1402         | 0.1541         | 0.1382         | 0.1628         | 0.5050    | 0.766    | 0.281    |
| В    | 6 | 0.9227       | 0.8645       | 1.067     | 0.1401         | 0.1533         | 0.1381         | 0.1624         | 0.5051    | 0.775    | 0.281    |
| В    | 7 | 1.0394       | 1.0394       | 1.000     | 0.1456         | 0.1456         | 0.1430         | 0.1466         | 0.5047    | 0.586    | 0.586    |
| В    | 8 | 1.1845       | 1.1844       | 1.000     | 0.1453         | 0.1453         | 0.1465         | 0.1429         | 0.5048    | 0.592    | 0.592    |
| В    | 9 | 1.3150       | 1.3150       | 1.000     | 0.1450         | 0.1450         | 0.1444         | 0.1444         | 0.5050    | 0.601    | 0.601    |
| Ν    | 3 | 0.4321       | 0.4321       | 1.000     | 0.1577         | 0.1577         | 0.1493         | 0.1537         | 0.5118    | -0.818   | -0.818   |
| Ν    | 4 | 0.5836       | 0.5837       | 1.000     | 0.1581         | 0.1581         | 0.1501         | 0.1501         | 0.5107    | -0.833   | -0.833   |
| Ν    | 5 | 0.7187       | 0.7186       | 1.000     | 0.1570         | 0.1571         | 0.1493         | 0.1533         | 0.5089    | -0.857   | -0.857   |
| Ν    | 6 | 0.8655       | 0.8655       | 1.000     | 0.1577         | 0.1577         | 0.1499         | 0.1499         | 0.5090    | -0.865   | -0.865   |
| Ν    | 7 | 1.0004       | 1.0004       | 1.000     | 0.1575         | 0.1576         | 0.1491         | 0.1508         | 0.5085    | -0.876   | -0.876   |
| Ν    | 8 | 1.1451       | 1.1468       | 1.000     | 0.1577         | 0.1573         | 0.1500         | 0.1496         | 0.5082    | -0.880   | -0.889   |
| Ν    | 9 | 1.2683       | 1.2683       | 1.000     | 0.1574         | 0.1574         | 0.1498         | 0.1498         | 0.5080    | -0.892   | -0.892   |

原子的 Mülliken 电荷也列入表 1 中. 由表 1 可 见,在BN-NT 及其 C掺杂管中,Mülliken (B) 总 是为正值,而 Mülliken (N) 总是为负值;C在B位 掺杂的模型中,C与3个N原子相连,Mülliken (C) 原子的原子电荷为正值;而C在N位掺杂的模型 中,Mülliken (C) 为负值,与B,C和N原子的电负 性2.04,2.55和3.04相一致 (Pauling scale)<sup>[17]</sup>.当 n = 3,5,6时,两个原胞中的C原子的Mülliken值 并不相同,这与两原胞的结构变形(结构参数)不同 是一致的,其他模型中两个C原子的Mülliken值相 同,并随着n的增大而增大.所有C原子的N位掺 杂管,两个原子的Mülliken电荷值都相同,并随着 n的增大,Mülliken (C)的绝对值增大.可以看出, 两个原胞中的C原子的Mülliken值是否相同是与 模型的结构变形是否一致相统一的.

### 3.2 能量和掺杂能

C原子于B位或N位掺杂BN-NT的B-C-N纳 米管模型,稳定性可用掺杂能量( $\Delta E_d$ )来衡量.定 义掺杂能量( $\Delta E_d$ )为一个单元模型的每个原子在 掺杂前后能量变化的平均值:

 $\Delta E_{\rm d} = [E_{\rm d,B-C-NNT} - E_{\rm CNT}]$ 

$$+ (n_{\text{atom}} - y)E_{\text{C atom}} - (xE_{\text{B atom}} + zE_{\text{N atom}})]/n_{\text{atom}}, \quad (1)$$

(1) 式中 $E_{d,B-C-N NT}$ 和 $E_{CNT}$ 分别代表三元体系 B-C-N纳米管和未掺杂CNT单元模型的能量;  $E_{B \text{ atom}}$ 和 $E_{N \text{ atom}}$ 和 $E_{C \text{ atom}}$ 分别代表B,N和C 原子的能量, $n_{\text{atom}}$ 表示原胞中所含原子数目.在 本文中,一个单元模型包含了两个原胞,掺杂能量 ( $\Delta E_d$ )与n的关系如图 2 所示,数据列于表 2 中.

从图 2 可以看出, 对于相同的 *n*, B 位掺杂模型 的掺杂能量  $\Delta E_d$  比 N 位掺杂要大, 说明 N 位掺杂 构型更稳定, 掺杂也更容易. 当*n* 较小时, B 位与 N 位掺杂管的  $\Delta E_d$  相差较大, 如 *n* = 3,4时, 两者相 差分别为 0.158 和 0.124 eV·atom<sup>-1</sup>; 随着 *n* 的增大, 两者的相差值减小. 当*n* = 9 时, 两值相差减小为 0.056 eV·atom<sup>-1</sup>.



图 2 PBC-B3LYP/3-21G(d) 方法计算的 C 原子取代 B 位或 N 位的 B-N-C 纳米管的掺杂能  $\Delta E_d = n$  的关系

| 表 2 | $C 原子取代 B 位或 N 位的 B_x N_y C_z$ 纳米管的 |
|-----|-------------------------------------|
|     | 掺杂能量 [(1) 式]                        |

| NT 模型<br>(n, n) | $\Delta E_{\rm d} [C_{\rm B-doped}]$<br>/eV·atom <sup>-1</sup> | $\Delta E_{\rm d} [C_{ m N-doped}]$<br>/eV·atom <sup>-1</sup> |
|-----------------|--|---|
| (3, 3)          | 0.270  | 0.112   |
| (4, 4)          | 0.216  | 0.092   |
| (5, 5)          | 0.168  | 0.076   |
| (6, 6)          | 0.141  | 0.065   |
| (7, 7)          | 0.127  | 0.056   |
| (8, 8)          | 0.112  | 0.050   |
| (9, 9)          | 0.101  | 0.045   |

#### 3.3 能带结构特征

C原子在B位或N位掺杂的BN纳米管的一维 能带结构如图3所示(当n = 7—9时,能带结构相 仿,因此只例举了n = 3—6,8能带图).图中绘出 了5条最高占据轨道(实线)和5条最低非占据轨道 (虚线)的能带,对应的能隙如表3所列.

结果表明, 当n较大时, 能带结构有不程度 的兼并. C原子无论在B位还是在N位的掺杂模 型(n = 3 - 9),能隙的类型都是直接带隙,即两 端未封口超长纳米管的一维晶体模型,其能带结 构的晶体最高占据轨道(HOCO)导带低与晶体最 低非占据轨道(LUCO)价带顶对应同一个k点, 且这一点都对应于图中的X点.对于相同的n, 所有B位掺杂( $C_{B-doped}$ )的能隙比N位( $C_{B-doped}$ ) 大. 当n = 3, 5, 6时, B 位掺杂管为宽带隙半导 体,能隙分别为2.411, 2.345和2.305 eV,是宽带隙 半导体;其他的n = 3—8的B位掺杂管能隙值在 0.937—1.054 eV之间, 为典型的半导体. 这个结果 与当n=3, 5, 6时所得C原子的Mülliken(C)原子 电荷不同于其他模型是一致的. 当n = 3-8时, 所 有N位掺杂管(C<sub>N-doped</sub>)都是典型的半导体,能隙 值在0.171—1.207 eV. 当n = 9时, B位和N位掺杂 管都是金属管,两值相近,为0.057 eV.而n = 7-9 的B位掺杂管和N位掺杂管都为典型半导体,对于 相同的n,所有B位掺杂管的能隙比N 位掺杂大, 所得结论与文献[12]相似,即B位掺杂的模型比N 位掺杂的带隙宽.

有趣的是, B 位掺杂的n = 3的管的能隙值比 n = 4的管明显大, 高出 1.3 eV, n = 5,7的管的能 隙值分别比n = 6,8稍大, 能隙值体现出与n的奇 偶有关的特征, 而 B 位掺杂管这一特征更加明显, n = 3, 5, 7的管的能隙值分别比n = 4, 6, 8的管高 出 1.0, 0.8, 0.4 eV, 能隙值体现出与n的奇偶明显 相关的特征. 这与几何结构变化的规律一致, 是掺 杂原子改变了C 原子的电子散射中心的变化特征 所致.

### 4 结 论

本文用 B3LYP/3-21G(d) 密度泛函方法,并利 用周期边界条件,研究了C在不同位置掺杂的(n, n)型BN 纳米管(掺杂比例 x 为 1/20)的几何结构、 掺杂能量和能带结构.主要结论如下:

当 n = 3, 5, 6 时, B 位 掺杂 BN 纳米管的
 两原胞中的结构参数如 N—C 键长并不相等; 而当
 n = 4 和 n = 7—9 时, B 位掺 杂管的结构参数并无



图 3 C在B或N位掺杂的 (n, n) BN-NT 模型的能带结构 [PBC-B3LYP/3-21G(d)] 实线为满带, 虚线为空带, 各绘制5条, **k** 点为波矢 **k** 的取值数; LUCO的最大值、HOCO 的最小值和能隙 *E*<sub>g</sub>用箭头标出 (a) C<sub>B-doped</sub> (3, 3) BN-NT; (b) C<sub>N-doped</sub> (3, 3) BN-NT; (c) C<sub>B-doped</sub> (4, 4) BN-NT; (d) C<sub>N-doped</sub> (4, 4) BN-NT; (e) C<sub>B-doped</sub> (5, 5) BN-NT; (f) C<sub>N-doped</sub> (5, 5) BN-NT; (g) C<sub>B-doped</sub> (6, 6) BN-NT; (h) C<sub>N-doped</sub> (6, 6) BN-NT; (i) C<sub>B-doped</sub> (8, 8) BN-NT; (j) C<sub>N-doped</sub> (8, 8) BN-NT

| NT 模型  | $C_{B-doped}$           |                         |                      |      | C <sub>N-doped</sub>    |                         |                      |      |  |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|--|
| (n, n) | $E_{\rm HOCO}/{\rm eV}$ | $E_{\rm LUCO}/{\rm eV}$ | $E_{\rm g}/{\rm eV}$ | 能隙类型 | $E_{\rm HOCO}/{\rm eV}$ | $E_{\rm LUCO}/{\rm eV}$ | $E_{\rm g}/{\rm eV}$ | 能隙类型 |  |
| (3, 3) | -4.767                  | -2.356                  | 2.411                | 直接   | -5.854                  | -4.647                  | 1.207                | 直接   |  |
| (4, 4) | -3.461                  | -2.407                  | 1.054                | 直接   | -5.440                  | -5.156                  | 0.283                | 直接   |  |
| (5, 5) | -4.170                  | -1.825                  | 2.345                | 直接   | -5.732                  | -4.904                  | 0.828                | 直接   |  |
| (6, 6) | -4.023                  | -1.718                  | 2.305                | 直接   | -5.435                  | -5.183                  | 0.252                | 直接   |  |
| (7, 7) | -2.869                  | -1.916                  | 0.953                | 直接   | -5.548                  | -5.054                  | 0.494                | 直接   |  |
| (8, 8) | -2.765                  | -1.828                  | 0.937                | 直接   | -5.377                  | -5.206                  | 0.171                | 直接   |  |
| (9, 9) | -2.217                  | -2.160                  | 0.057                | 直接   | -5.316                  | -5.258                  | 0.057                | 直接   |  |

表3 C在B或N位掺杂的 (n, n) BN-NT的 HOCO或LUCO能量、能隙  $(E_g = E_{LUCO} - E_{HOCO})$ 以及能隙的类型 [PBC-B3LYP /3-21G(d) 方法]

差别, 而所有N位掺杂管中, 两个原胞中的结构参 数相同;

2) 对于相同的 n, B 位掺杂的 BN 纳米管的掺杂能量比 N 位掺杂的要大2 倍多, 说明 N 位掺杂的 构型稳定, 掺杂也更容易;

3) 当n = 3—6时, B位和N位掺杂的BN纳米 管为直接带隙, 而n = 7—9的大管为直接带隙; 当 n = 3, 5, 6时, B 位掺杂管为宽带隙半导体, 能隙 分别为2.411, 2.345和2.305 eV, 而n = 7—9的B 位掺杂管和所有的N位掺杂管都为典型半导体; 对 于相同的n, 所有B位掺杂管的能隙比N位掺杂大.

#### 参考文献

- Yoshiyuki M, Angel R, Marvin L C, Steven G L 1994
   *Phys. Rev. B* 50 4976
- [2] Blase X, Charlier J C, Vita A D, Car R 1997 *Phys. Lett.* 70 197
- [3] Chen Y, Barnard J C, Palmer R E, Watanabe M O, Sasaki T 1999 Phys. Rev. Lett. 83 2406
- [4] Bai X D, Guo J D, Yu J, Wang E G, Yuan J, Zhou W Z 2000 Appl. Phys. Lett. 76 2624
- [5] Bai X D, Wang E G, Yu J, Yang H 2000 Appl. Phys. Lett. 77 67

- [6] Terrones M, Benito A M, Manteca-Diego C, Hsu W K, Osman O I, Hare J P, Reid D G, Terrones H, Cheetham A K, Prassides K, Kroto H W, Walton D R M 1996 *Chem. Phys. Lett.* **257** 576
- [7] Louchev O A, Sato Y, Kanda H, Bando Y 2000 Appl. Phys. Lett. 77 1446
- [8] Azevedo S, Rosas A, Machado M, Kaschny J R, Chacham H 2013 J. Solid State Chem. 197 254
- [9] Li F, Xia Y Y, Zhao M W, Liu X D, Huang B, Ji Y J, Song C 2006 *Phys. Lett. A* 357 369
- [10] Guo C S, Fan W J, Zhang R Q 2006 Solid State Commun. 137 246
- [11] Mahmoud M 2009 Physica E **41** 883
- [12] Zhao J X, Dai B Q 2004 Mater. Chem. Phys. 88 244
- [13] Wang Y L, Su K H, Wang X, Liu Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 098111 (in Chinese)[王艳丽, 苏克和, 王欣, 刘艳 2011 物理学报 60 098111]
- [14] Wang Y L, Zhang J P, Su K H, Wang X, Liu Y, Sun X 2012 Chin. Phys. B 12 060301
- [15] Wang Y L, Su K H, Wang X, Liu Y, Ren H J, Xiao J 2012 Chem. Phys. Lett. 532 90
- [16] Frisch M J, Trucks G W, Schlegel H B, et al 2009 Gaussian 09 Revision A.02, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009
- [17] Truhlar D G, Isaacson A D, Garrett B C 1985 Theory of Chemical Reaction Dynamics (New York: New York Press) p65

# Investigation of C atom doped armchair (n, n) single walled BN nanotubes with density functional theory<sup>\*</sup>

Wang Yan-Li<sup>†</sup> Su Ke-He Yan Hong-Xia Wang Xin

(Key Laboratory of Space Applied Physics and Chemistry, Ministry of Education of China, School of Natural and Applied Sciences, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

(Received 8 September 2013; revised manuscript received 1 November 2013)

#### Abstract

Structures and properties of single walled (n, n) BN nanotubes doped with the C atom at different positions are studied by the DFT B3LYP/3-21G(d) theoretical method combined with the one-dimensional (1D) periodic boundary conditions. Their structure parameters, energies, stabilities, band structures and the energy gaps are explored. For the BN nanotubes doped with the C atom at different positions, the C atom concentrations x = 1/4n (n = 3-9) are examined. It is found that the N site tubes are almost undistorted and more stable. The band gaps are within 1.054–2.411 eV for the C atom doped at the B sites, and those are narrower and within 0.252–1.207 eV for the N sites. All of the doped tubes are shown to be semiconducting and have direct gaps.

Keywords: doped, carbon nanotubes, periodic boundary condition, band structure

**PACS:** 61.46.Np, 81.07.De

**DOI:** 10.7498/aps.63.046101

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50572089) and the Basic Research Foundation of Northwestern Polytechnical University, China (Grant No. JC201269).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: wangyanli@nwpu.edu.cn